

บทที่ ๒
การวัดค่าคงที่ ณ ความถี่แสง

๒.๑ บทนำ

ในการศึกษาเวลาผ่อนคลาย τ ของสารไดอิเล็กตริก โดยอาศัยสมการ (๑.๘.๒๔)

$$\epsilon' = \epsilon_\infty + \left(\frac{1}{\omega\tau}\right) \epsilon'' \quad (๒.๑.๑)$$

และโมเมนต์ของไดโพลถาวรทางไฟฟ้า μ ของสารไดอิเล็กตริก โดยอาศัยสมการ (๑.๖.๑๕)

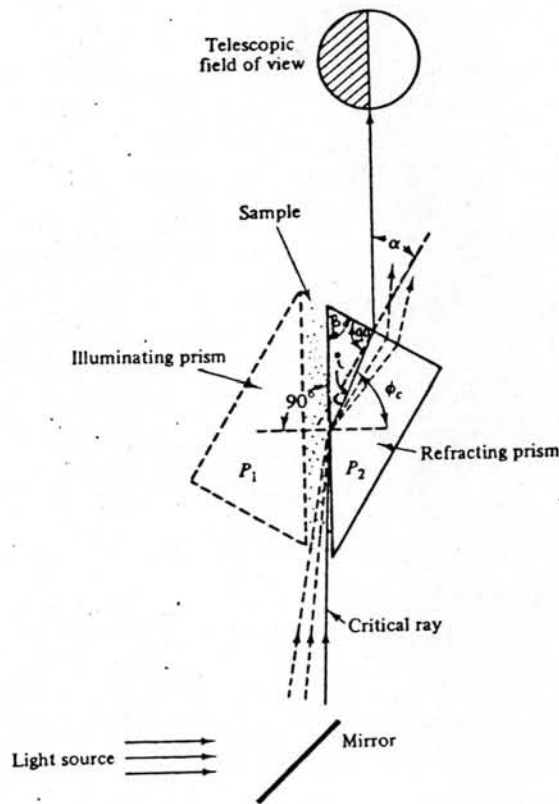
$$\mu = \frac{9kT}{4\pi N} \left(\frac{3}{(\epsilon_1 + 2)(n_1^2 + 2)} \right) \left[\frac{d\Delta}{dc} \right]_{c \rightarrow 0} \quad (๒.๑.๒)$$

เราต้องทราบค่าต่าง ๆ กล่าวคือ ϵ' , ϵ'' ซึ่งเราหาได้โดยอาศัยการหาสัมประสิทธิ์การสะท้อนของคลื่นไมโครเวฟในท่อนำคลื่น (จะบอกกล่าวต่อไปโดยละเอียดในบทต่อไป) ส่วน ϵ_∞ หาได้โดยอาศัยสมการ (๑.๘.๔) ซึ่งอาศัยทฤษฎีของแมกเวลล์โดยรายละเอียดแสดงอยู่ในภาคผนวกที่ ๒ ในบทนี้เราจะกล่าวถึงการวัดค่า ϵ_∞ นี้

๒.๒ การวัดค่าการรบกวนหักเหของสาร^๘

การหาค่าการรบกวนหักเหของสารที่เป็นของเหลวมีอยู่ด้วยกันหลาย ๆ วิธี ถ้าของเหลวนั้นไม่ทึบแสงมากนัก เราอาจหาค่าการรบกวนหักเหโดยตรงโดยอาศัยกล้องจุลทรรศน์ชนิดเคลื่อนที่ (traveling microscope) แต่วิธีนี้มีความคลาดเคลื่อนมาก เราอาจหาค่าการรบกวนหักเหของสารที่เป็นของเหลวโดยอาศัยรีแฟรกโตมิเตอร์ (refractometer) ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ แต่แบบที่ใช้ทดลองเป็นแบบ แอบรินแฟรกโตมิเตอร์ (Abbe refractometer) เครื่องมือนี้อาศัยหลักของมุมวิกฤตรีแฟรกโตมิเตอร์ (critical angle refractometer) ซึ่งประกอบด้วยปริซึมสองอัน คือ P_1 และ P_2 ดังแสดงในรูป (๒.๒.๑) โดยที่ P_2 เรียกว่าปริซึมหักเห (refracting prism) และ P_1 เป็นปริซึมกระจายแสง (illuminating prism) แสงที่สะท้อนจากกระจกเงา M ย่นเข้ามาในช่องระหว่าง P_1 และ P_2 ซึ่งบรรจุสารที่เป็นของเหลวที่ถ่วงการวัดการรบกวนหักเห ซึ่งเป็นฟิล์มบาง ๆ หนาเพียง ๐.๑ มิลลิเมตรเท่านั้น แสงจะเจียศผิวของปริซึม P_2 แล้วเกิดการหักเห

ผ่าน P_2 โดยทำมุมต่าง ๆ กัน โหมด ϕ_c เป็นมุมที่แสงหักเหได้มากที่สุด เรียกมุมนี้ว่ามุมวิกฤต ซึ่ง
 เป็นมุมที่เกิดจากรังสีของแสงซึ่งมีมุมกระทบเท่ากับมุมฉากจากตัวกลางที่มีครรชนหักเห (n_s) น้อยกว่า
 ไปยังตัวกลางที่มีครรชนหักเห (n_p) มากกว่า เพื่อสะดวกในการทดลองเราให้แสงสีเดียวกันผ่าน
 (เนื่องจากแสงที่มีความยาวคลื่นต่างกันจะหักเหต่างกันด้วย) เราใช้แสงที่เกิดจากโซเดียม ดังนั้น
 พิจารณาจากรูป (๒.๒.๑) จะได้ว่าภาพที่ปรากฏในกล้องจุลทรรศน์จะมีลักษณะบริเวณมืดและบริเวณ
 สว่าง



รูปที่ ๒.๒.๑ แสดงมุมวิกฤตรีแฟกโทมิเตอร์

ถ้าให้

- n_s เป็นครรชนหักเหของสาร
- n_p เป็นครรชนหักเหของปริซึม มีค่าประมาณ ๑.๕
- β เป็นมุมยอดของปริซึม
- θ เป็นมุมตกกระทบของแสงในหน้าที่สองของปริซึม
- ϕ_c เป็นมุมวิกฤต
- α เป็นมุมหักเหในหน้าที่สองของปริซึม

จากกฎของสเนล (Snell's law) จะได้ว่า
 หน้าที่หนึ่งของปริซึม

$$n_s \sin 90 = n_p \sin \phi_e$$

$$\sin \phi_e = \frac{n_s}{n_p}$$

(๒.๒.๑)

หน้าที่สองของปริซึม

$$\sin \alpha = n_p \sin i$$

(๒.๒.๒)

จากการพิจารณา

$$i = \phi_e - \beta$$

(๒.๒.๓)

แทนสมการ (๒.๒.๓) ลงใน (๒.๒.๒)

$$\sin \alpha = n_p \sin (\phi_e - \beta)$$

$$= n_p \{ \sin \phi_e \cos \beta - \cos \phi_e \sin \beta \}$$

$$= n_p \{ \sin \phi_e \cos \beta - \sqrt{1 - \sin^2 \phi_e} \sin \beta \}$$

(๒.๒.๔)

แทนสมการ (๒.๒.๑) ลงใน (๒.๒.๔)

$$\sin \alpha = n_p \left\{ \frac{n_s}{n_p} \cos \beta - \sqrt{1 - \frac{n_s^2}{n_p^2}} \sin \beta \right\}$$

$$= n_s \cos \beta - \sqrt{n_p^2 - n_s^2} \sin \beta$$

$$\therefore \sqrt{n_p^2 - n_s^2} = n_s \cot \beta - \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$



$$n_p^2 - n_s^2 = n_s^2 \cot^2 \beta - 2n_s \cot \beta \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} + \frac{\sin^2 \alpha}{\sin^2 \beta} \quad (2.2.5)$$

จากสมการ (๒.๒.๕) จักเทอมใหม่ได้

$$n_s^2 - (2 \cos \beta \sin \alpha) n_s - (n_p^2 \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha) = 0 \quad (2.2.6)$$

จากสมการ (๒.๒.๖) เราสามารถหาค่า n_s ได้ดังนี้

$$n_s = \cos \beta \sin \alpha + \sqrt{\cos^2 \beta \sin^2 \alpha + n_p^2 \sin^2 \beta + \sin^2 \alpha} \quad (2.2.7)$$

ดังนั้นจากสมการ (๒.๒.๗) ถ้าเราทราบค่า α, β, n_p เราก็จะสามารถหาค่ากรรณหักเหของสารตัวอย่างได้ ซึ่งจะเห็นว่า β ซึ่งเป็นมุมยอดของปริซึมจะมีค่าคงที่ n_p เป็นกรรณหักเหของแก้วที่ทำเป็นปริซึมมีค่าเท่ากับ ๑.๕ ดังนั้น n_s จึงขึ้นอยู่กับมุม α ซึ่งสามารถวัดได้ เราอาจปรับปรุงมุมวิศุทธิ์แฟลกโคมิเตอร์ โดยแทนที่จะให้แสงผ่านเจียค P_2 ซึ่งอาจทำให้ไม่แน่นอน เราให้แสงผ่าน P_1 ซึ่งทำหน้าที่หักเหแสงตกกระทบแล้วให้แสงที่ออกจาก P_1 นั้นเจียคไปบนระนาบของ P_2 ทำให้เกิดมุมวิศุทธิ์เหมือนวิธีแรกซึ่งจะได้ค่าที่แน่นอน

๒.๓ ส่วนประกอบของแอมบีแฟล็กโคมิเตอร์

มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

๒.๓.๑ ปริซึมสองอันคือ

ก. ปริซึมหักเหแสง P_2

ข. ปริซึมกระจายแสง P_1 เป็นส่วนช่วยให้แสงหักเหขนาดกับ P_2 เป็นรังสีวิศุทธิ์

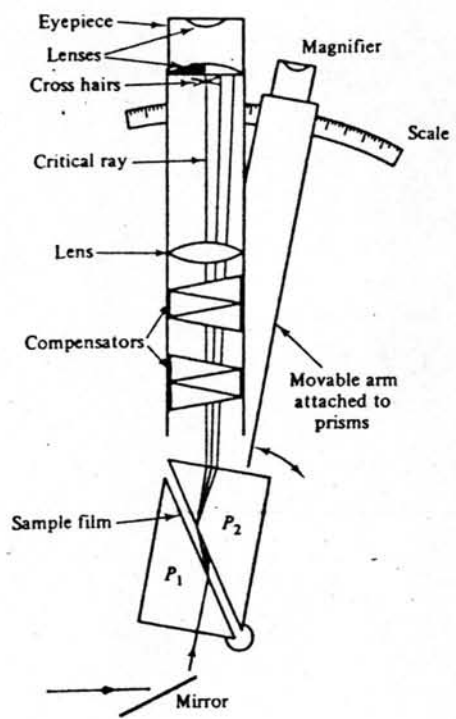
(critical ray) ซึ่งทำให้เกิดมุมวิศุทธิ์ (critical angle) เราจึงเรียกปริซึมนี้ว่าปริซึมช่วย (auxilliary prism.)

๒.๓.๒ ปริซึมแยกแสง(Compensater prism) เป็นปริซึมที่ทำหน้าที่แยกแสงความถี่

เดียว (monochromatic light) จะได้แสงสีที่ต้องการจากแสงสีขาว ในกรณีนี้แสงที่ใช่เป็นแสงสีขาว

๒.๓.๒ กระจกสะท้อนแสงทำหน้าที่สะท้อนแสงจากจุดกำเนิดให้เข้าสู่ปริซึม

๒.๓.๔ กล้องจุลทรรศน์เป็นตัวสังเกตตำแหน่งของรังสีวิกฤต ในการวัดทำให้รอยต่อของบริเวณมืดกับบริเวณสว่างตรงกับเส้นกนกอากาศ (cross wire) ในตัวกล้องพอดี การปรับหาค่าแห่งคั้งกลาวเราหมุนแขน (movable arm) ซึ่งติดอยู่กับปริซึม P_1 และ P_2 จนกระทั่งพบมุมวิกฤตคั้งแสดงในรูป (๒.๒.๒) จากนั้นเราสามารถอ่านมุม ω ได้ แต่สเกลจะถูกปรับให้อ่านเป็นค่าของกรรณนี้หักเหของสารได้โดยตรง



รูปที่ ๒.๒.๒ แสงแอมบีรีแฟรคโตมิเตอร์

แอมบีรีแฟรคโตมิเตอร์ ใ้ค้ออกแบบสำหรับวัดค่ากรรณนี้หักเหของของเหลวโดยที่ใ้สารระหว่าง P_1 และ P_2 ซึ่งพบใ้ค้อทำให้สารเป็นฟิล์มบาง ๆ หนาประมาณ ๐.๑ มิลลิเมตร เครื่องมือนี้วัดค่ากรรณนี้หักเหระหว่าง ๑.๓ ถึง ๑.๗ ค่ากรรณนี้หักเหที่จ๊ักใ้ค้อจากเครื่องมือนี้จะมีคววมแม่นยำมาก สามารถอ่านใ้ค้อศนิยมถึง ๔ ค่าแห่ง มีความผิดพลาด ๐.๐๐๐๑ เท่านั้น

โดยใ้ค้อเครื่องมือวัดค่ากรรณนี้หักเหของสารที่ใ้ค้อในการทดลอง คั้งนี้

เบนซีน (benzene) $C_6H_6 = ๑.๘๘๘$

MBBA in benzene .๒๐ mole fraction = ๑.๘๐๑๘

EBBA in benzene .๐๒ mole fraction = ๑.๘๘๘๑

โดยใช้สมการ (๒.๒.๗) เมหาค่าคงที่ของไดอิเล็กทริกที่ความถี่แสง (ϵ_{∞}) ได้ดังนี้

เบนซีน (benzene) $C_6H_6 = ๒.๒๑๘๘$ (๒.๒.๘)

MBBA in benzene .๐๒ mole fraction = ๒.๒๘๘๗ (๒.๒.๙)

EBBA in benzene .๐๒ mole fraction = ๒.๒๘๗๗ (๒.๒.๑๐)